

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和7年2月12日

国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学

理事 河野 広幸

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 17

○第4号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量

集束イオンビーム・走査型電子顕微鏡複合装置 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和7年度

(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件

集束イオンビームと走査型電子顕微鏡による高精度での試料作製・解析が可能な先進的な複合装置であること。その他詳細は導入説明書で示す。

2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。

(1) 資料等の提供期限 令和7年3月17日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）

(2) 提供先 〒923-1292 石川県能美市旭台1-1 北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係長 中西 達也 電話 0761-51-1104

3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。

(1) 交付期間 令和7年2月12日から令和7年3月17日まで。

(2) 交付場所 上記2(2)に同じ。

4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。

(1) 開催日時 令和7年2月14日10時00分

(2) 開催場所 北陸先端科学技術大学院大学本部棟2階中会議室（又はオンライン開催）
（オンライン開催の詳細は導入説明書交付時に別途案内する。）

5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。

6 Summary

(1) Classification of the products to be procured : 24

(2) Nature and quantity of the products to be purchased : Focused Ion Beam-Scanning Electron Microscope (FIB-SEM) system 1 Set

(3) Type of the procurement : Purchase

(4) Basic requirements of the procurement :

It is an advanced composite system that enables high-precision sample preparation and analysis using focused ion beam and scanning electron microscope techniques. Further details are provided in the Introduction Manual for Procurement.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 17 March, 2025

(6) Contact point for the notice : Tatsuya Nakanishi, Procurement Section, Accounting Department, Administrative Division, Japan Advanced Institute of Science and Technology, 1-1 Asahidai Nomi-Ishikawa 923-1292 Japan, TEL 0761-51-1104